



(43) 國際公開日
2005 年 10 月 27 日 (27.10.2005)

PCT

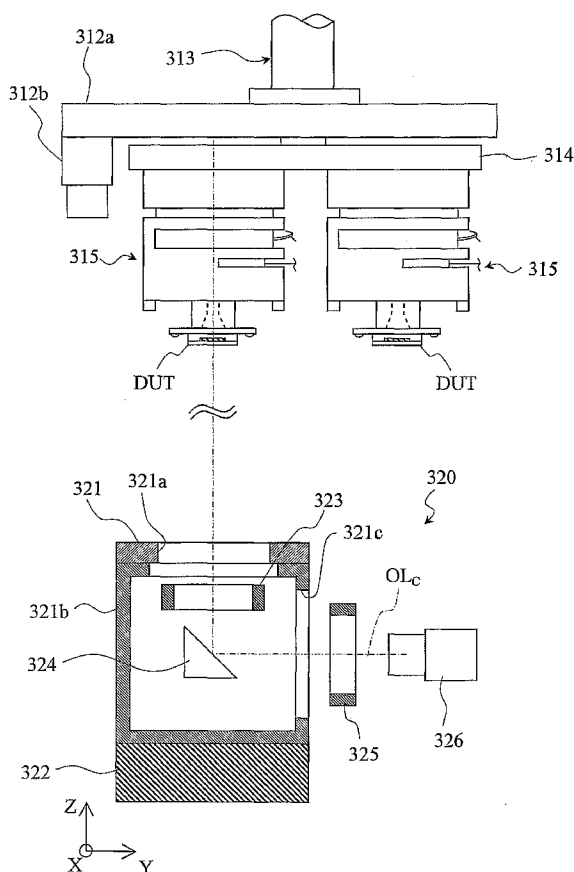
(10) 国際公開番号
WO 2005/100944 A1

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| (51) 国際特許分類 ⁷⁾ :
H01L 27/14, G01R 31/26 | G01M 11/00, | (KIYOKAWA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町 1 丁目 3 2 番地 1 号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/004665 | (74) 代理人: 前田 均, 外(MAEDA, Hitoshi et al.); 〒1010051 東京都千代田区神田神保町 1 丁目 1-17 東京堂神保町第 3 ビル 2 階 前田・西出国際特許事務所 Tokyo (JP). |
| (22) 国際出願日: | 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004) | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町 1 丁目 3 2 番 1 号 Tokyo (JP). | | |
| (72) 発明者; および | | |
| (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 清川 敏之 | | |

[続葉有]

(54) Title: TEST EQUIPMENT FOR IMAGE SENSOR

(54) 発明の名称: イメージセンサ用試験装置



(57) Abstract: Test equipment for image sensor in which optical characteristics of an image sensor (DUT) are tested by inputting/outputting electric signals from a contact part to the input/output terminals of the image sensor while irradiating the light receiving surface of the image sensor (DUT) with light. The image sensor (DUT) gripped by means of a contact arm (315) is imaged through a first camera (326); relative position of the image sensor (DUT) to the contact part is recognized through image processing; alignment amount of the image sensor (DUT) is calculated from the relative position while considering a previously calculated shift of the optical axis of the image sensor (DUT) from the optical axis of a light source; a driving section (322) is driven according to the alignment amount; and under a state where a lock and free mechanism (318) is not locked, a grip side arm (317) in abutment with a movable stage (321) is moved.

(57) 要約: イメージセンサ (DUT) の受光面に光を照射しながらコンタクト部からイメージセンサの入出力端子に電気信号を入出力することによりイメージセンサ (DUT) の光学的特性を試験するイメージセンサ用試験装置であって、コンタクトアーム (315) に把持された状態のイメージセンサ (DUT) を第1のカメラ (326) で撮像し、画像処理によりイメージセンサ (DUT) のコンタクト部に対する相対位置を認識し、この相対位置に、予め算出されている光源の光軸に対するイメージセンサ (DUT) の光軸のズレ量を加味してイメージセンサ (DUT) のアライメント量を算出し、これに基づいて駆動部 (322) を駆動させて、ロックアンドフリー機構 (318) が非拘束となっている状態で、可動ステージ (321) に当接している把持側アーム (317) を移動させる。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。